

MA.11	APPORTS DE LA MICROSCOPIE ELECTRONIQUE EN SCIENCE DES MATERIAUX				
<b>Objectifs :</b> <i>Donner aux utilisateurs potentiels (ingénieurs, techniciens) de ce type de matériel un ensemble de connaissances centré sur l'investigation de matériaux divers à l'aide de techniques pointues basées sur l'émission d'électrons.</i>					
<b>Public concerné</b>			<b>Pré-requis</b>		
Ingénieurs, Techniciens Supérieurs			Conception Mécanique, Science des Matériaux		
Niveau	Session (s)	Durée	Début	Fin	Volume horaire
I	1	2 jours	9h	16h	12 heures
<b>Répartition du volume horaire</b>					
06 h cours ; 06 heures TP					
<b>Contenu du programme</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Principe de la Microscopie Electronique (MEB, MET)</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <i>Electrons Secondaires - Electrons Rétro diffusés - Rayons X (ou photons X)</i></li> </ul> </li> <li>• <i>Fonctionnement</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <i>Canons à Electrons</i></li> <li>❖ <i>Colonnes Electroniques</i></li> <li>❖ <i>Détecteurs d'Electrons Secondaires</i></li> <li>❖ <i>Détecteurs d'électrons rétro diffusés (mode composition, mode topographique)</i></li> <li>❖ <i>Détecteurs de Rayons X (EDS)</i></li> <li>❖ <i>Formation de l'image</i></li> <li>❖ <i>Microanalyse</i></li> </ul> </li> <li>• <i>Travaux pratiques</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <i>Préparation des échantillons</i></li> <li>❖ <i>Imagerie en Electrons Secondaires - Imagerie en Electrons Rétro diffusés</i></li> </ul> </li> </ul> <p><i>Microanalyses et Interprétations</i></p>					
<b>Enseignant responsable du stage</b>		<b>Enseignant</b>		<b>Coût du stage (en H.T.)</b>	
M. K. NECIB. (EMP)		M. A. BRITAH. (EMP)		15000,00 DA	